

## Física General IV: Óptica

### Práctico de Laboratorio N°8: Interferómetro de Michelson

**Objetivo:** Calibración del interferómetro y su empleo en la medición del índice de refracción del vidrio y del índice de refracción del aire .

**Introducción:** El interferómetro de Michelson es un instrumento de interferometría por división de amplitud que utiliza espejos. El divisor del haz consiste en una placa semi-transparente  $P$  (ver Figura 1) que separa la luz incidente en dos haces perpendiculares de igual amplitud. Los haces son reflejados sobre sus caminos por los espejos  $M_1$  y  $M_2$ . El haz reflejado por  $M_1$  es reflejado por el divisor antes del llegar al detector, donde interfiere con el haz proveniente de  $M_2$  que atravesó el divisor.

De esta forma, los haces que llegan al detector por cualquiera de los caminos resultan reflejados una vez en la placa semi-transparente, pero el haz que llega desde  $M_1$  atravesó tres veces el divisor  $P$ , mientras que el que llega desde  $M_2$  lo atravesó una sola vez. Para igualar el recorrido en vidrio de los haces, se coloca entonces la placa compensador  $C$ , que es una réplica de  $P$  (pero sin el semiplateado), y también posicionada a  $45^\circ$  con respecto a la dirección del haz horizontal. Considerando la placa compensadora, toda diferencia de camino óptico entre los haces que arriban al detector proviene de una diferencia neta de distancia recorrida desde la fuente. Usualmente se utiliza una fuente extensa que se consigue iluminando con una lámpara intensa una placa de vidrio esmerilado, o ensanchando con una lente un haz láser. Al detector llegan haces paralelos y la imagen del patrón de interferencia se forma sobre una placa difusora o directamente proyectando con una lente sobre una pantalla.

Todos los haces generados por círculos concéntricos alrededor del eje óptico en la fuente, recorren igual camino hasta el detector. Por lo tanto, asumiendo que todos los puntos de la fuente son coherentes en fase, el patrón de interferencia es de franjas circulares. Para entender como estas franjas son generadas en la Figura 2 se presenta un diagrama conceptual del interferómetro, donde

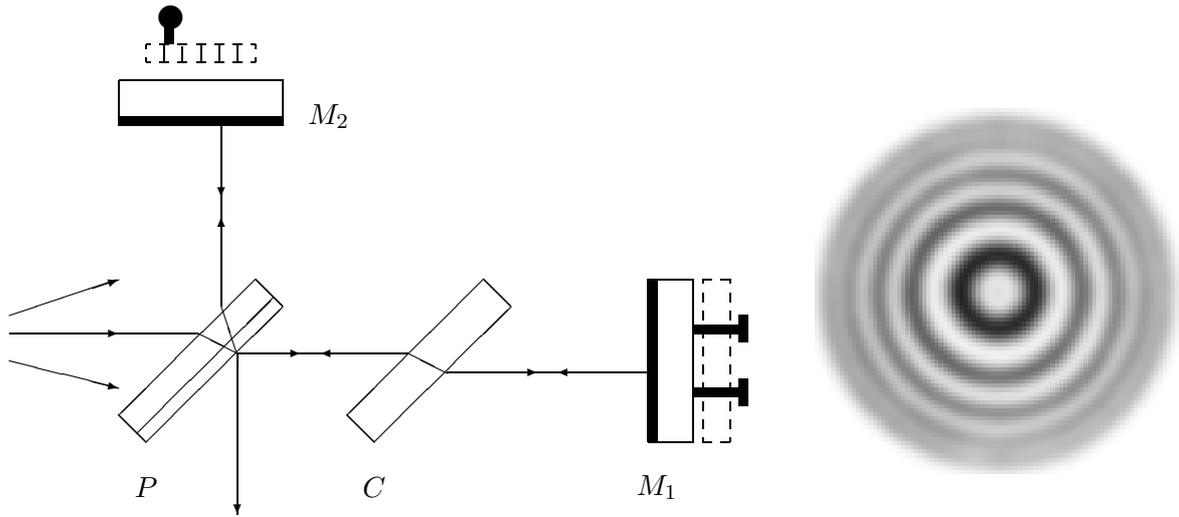


Figura 1: Diagrama esquemático del Interferómetro de Michelson y su patrón de interferencia.

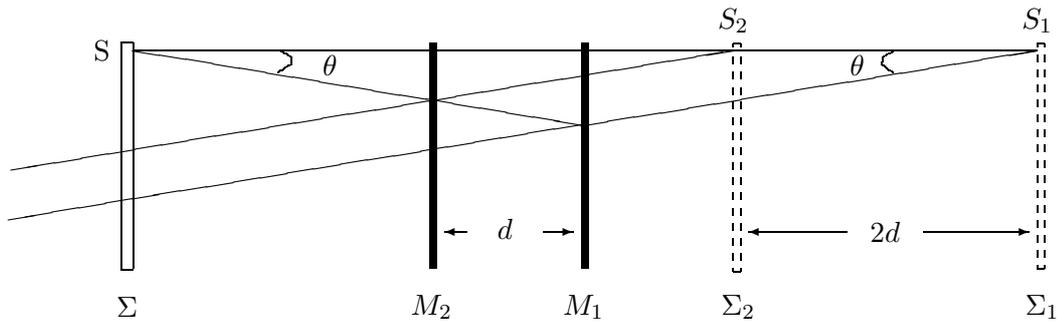


Figura 2: Diagrama conceptual del Interferómetro de Michelson.

las imágenes de la fuente  $\Sigma$  por los espejos  $M_1$  y  $M_2$  están representadas por  $\Sigma_1$  y  $\Sigma_2$ , respectivamente. Del diagrama puede observarse que si  $d$  es la separación efectiva entre los espejos  $M_1$  y  $M_2$ , la diferencia de camino óptico de los haces provenientes de un punto  $S$ , bajo un ángulo de observación  $\theta$  es  $2d \cos \theta$ .

Ahora, teniendo en cuenta que el haz proveniente de  $M_1$  ha sido reflejado externamente por la placa  $P$ , mientras que el proveniente de  $M_2$  fue reflejado internamente en  $P$ , ambos haces tienen una diferencia de fase en  $\pi$  por reflexión. Entonces, cuando la diferencia de caminos resulte un número entero de longitudes de onda se obtendrá **interferencia destructiva**

$$2d \cos \theta_m = m \lambda, \quad m \text{ entero.} \quad (1)$$

Se tendrá interferencia constructiva para

$$2d \cos \theta_m = \left(m + \frac{1}{2}\right) \lambda, \quad m \text{ entero.} \quad (2)$$

### Desarrollo Experimental:

En la práctica, la distancia  $d$  es inaccesible y sólo puede contarse el número de franjas que aparecen o desaparecen del diagrama (por ejemplo del centro del mismo,  $\theta = 0$ ) para una variación controlada de la distancia  $d$ . Con ese fin uno de los espejos es móvil a través de un mecanismo micrométrico.

### Experiencia 1: Calibración del Tornillo Micrométrico

Se ilumina el instrumento con un haz expandido de una laser de He-Ne. Se alinean correctamente todos los elementos del interferómetro hasta observar nítidamente las franjas circulares. Se desplaza suavemente el espejo móvil entre dos posiciones predefinidas del tornillo micrométrico, y se cuenta el número  $n$  de franjas que pasan por el diagrama de interferencia. De la Ec. (1) ó (2) se obtiene indistintamente (para  $\theta = 0$ ) que

$$\Delta d = n \frac{\lambda}{2}. \quad (3)$$

Esta relación permite calibrar la escala del tornillo. Luego, para una fuente monocromática incógnita permite medir la correspondiente longitud de onda.



### Experiencia 2: Medición del índice de refracción del vidrio

Colocando una placa de vidrio plano paralela de espesor  $t$  sobre uno de los haces del interferómetro, puede variarse la diferencia de camino óptico entre los haces, cambiando el ángulo de incidencia sobre la placa. Computando la longitud de recorrido en el interior de la placa, el índice de refracción de la placa quedará expresado por el número de franjas  $N$  que cambian en el patrón de interferencia al variar el ángulo de incidencia entre  $0$  y  $\theta$ , según la expresión

$$n = \frac{(2t - N\lambda)(1 - \cos \theta)}{2t(1 - \cos \theta) - N\lambda}. \quad (5)$$

### Experiencia 3: Medición del índice de refracción del aire

Colocando una celda de vacío de longitud  $D$  y caras paralelas, delgadas y transparentes con eje sobre uno de los haces del interferómetro, pueden cambiarse la longitud de camino, cambiando la presión del aire encerrado en la celda. En particular, dado que la frecuencia de la radiación viene dada por la fuente, la longitud de onda se relaciona con el índice de refracción del medio según  $\lambda = \lambda_0/n$ , donde  $\lambda_0$  es la longitud de onda correspondiente al vacío.

Supongamos que a una presión inicial  $p_i$ , el trayecto del haz dentro de la celda es un número entero de longitudes de onda  $N_i = 2D/\lambda_i$  (tener en cuenta que la celda es atravesada dos veces). Al cambiar la presión en la celda hasta un valor final  $p_f$ , el número de longitudes de onda será ahora  $N_f = 2D/\lambda_f$ . Así, el número  $N$  de franjas contadas en el patrón de interferencia será  $N = N_f - N_i = 2D(1/\lambda_f - 1/\lambda_i) = 2D(n_f - n_i)/\lambda_0$ , donde se asume que la presión final es mayor que la inicial. Por lo tanto,  $n_f - n_i = N\lambda_0/(2D)$ . Suponiendo que la relación  $n(p)$  es lineal  $n(p) = 1 + \alpha p$ , resulta que la pendiente está dada por

$$\alpha = \frac{N\lambda_0}{2D(p_f - p_i)}. \quad (6)$$

Verificar experimentalmente que la relación es lineal, midiendo varios valores de  $\alpha$  y determinar  $n_{atm}$ . Determinar si conviene trabajar desde la presión atmosférica hacia el vacío, o dejando llenar la celda vacía hasta la presión ambiente.

### Bibliografía:

E. Hecht, *Optics*, Addison Wesley, Reading, MA (1998), 3ed.

F. A. Jenkins y H. E. White, *Fundamentos de Óptica*, Aguilar, Madrid (1964).